

②
perenni

SISTEMATICI: si presentano in tutti gli esemplari R1.1b del sistema; praticamente errori di progetto (hw, sw) sfuggiti alla fase di Debug.

OCCASIONALI: Presenti in una particolare realizzazione, sono dovuti al processo di realizzazione o agli stress durante la vita operativa.

in 2029
③

PERMANENTI: le questo c'è e ci resta

TEMPORANEI — TRANSITORI: indotti da particolari e anomale condizioni operative, scompare senza lasciare tracce (!!?)

INTERMITTENTI: vanno e vengono in modo casuale - generalmente evidenziano una criticità del progetto o una transizione verso il guasto permanente.

• Occorre poi tradurre il problema in termini quantitativi, per poter eseguire analisi e adottare strategie corrette di progetto. L'approccio è di tipo STATISTICO.

> Viene definita una variabile aleatoria e le sue principali statistiche

τ : tempo di vita

$y_{\tau}(t)$: densità di probabilità

$Y_{\tau}(t)$: distribuzione

$E\{\tau\}$: aspettazione di vita o

MTF (tempo medio al guasto)

MTBF (tempo medio tra guasti, per sistemi ripristinabili)

> In particolare si definisce

$R(t)$: affidabilità, probabilità di un tempo di vita superiore a t . (tempo di missione)

Si ha

$$R(t) = \int_t^{\infty} y_{\tau}(t) dt = 1 - Y(t)$$

• Come si vede si tratta di parametri probabilistici, che possono essere desunti con metodi statistici da esperimenti reali. R1.2

> Un esperimento che per sistemi complessi e articolati porta a un risultato caratteristico è il seguente:

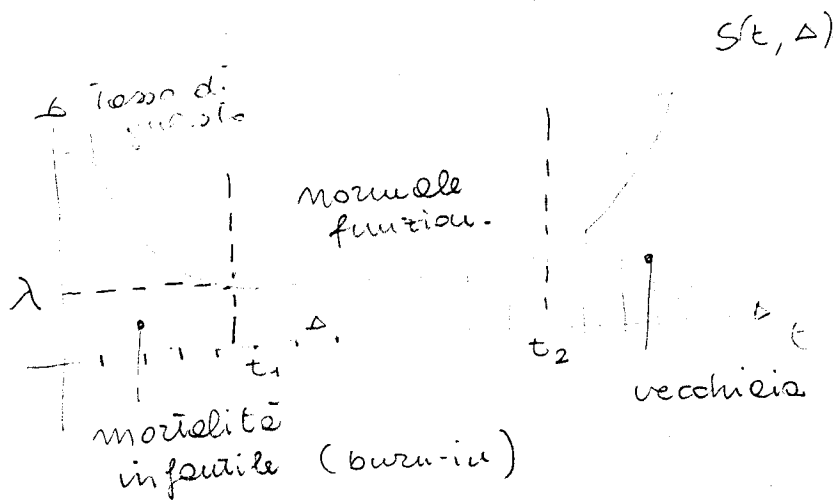
- si individua una popolazione di numerosi esemplari di un certo sistema
- si controlla nel tempo il numero di quelli che si rompono e di quanti continuano a funzionare
- si rapporta il numero di sistemi rotti in un certo periodo con il totale dei funzionanti all'inizio del periodo.

Esempio

giorno	Funzion	Guasti	Tasso di guasto
1	100	0	~
2	80	20	20%
3	70	10	12.5%
4	65	5	7.14%
5	61	4	6.15%
6	57	4	6.56%
7	53	3	5.26%
8	50	3	5.66%
9	47	3	6%
10	44	3	6.38%
11	41	2	4.55%
12	39	3	7.32%
13	36	6	15.4%
14	30	10	27.8%
15	20	15	50%
16	5	5	~



- Queste osservazioni danno origine a una curva caratteristica, detta a VASCA da BAGNO dove si riconoscono tre regioni



- L'individuazione di questa curva con la valutazione di t_1, t_2 e soprattutto λ può dare indicazioni sui valori dei parametri probabilistici
 - > Questo è alla base di ogni procedimento statistico, che opera attraverso meccanismi di coerenza interna. I parametri probabilistici "stimati" ci permettono di risalire al grado di probabilità di una certa osservazione che viene detto "grado di confidenza".
 - > Nel nostro caso, cosa indica $\Delta S(t, \Delta)$? Può essere considerato uno "stimatore" dell'evento { questo in $t, t+\Delta$ | dato che in t il dispositivo Ok } la probabilità di questo evento si può scrivere come

$$\frac{Y_c(t+\Delta) - Y_c(t)}{1 - Y_c(t)} = \Delta S(t, \Delta)$$

se l'intervallo Δ è sufficientemente piccolo si può scrivere

$$S(t) = \frac{1}{R(t)} \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{Y_c(t+\Delta) - Y_c(t)}{\Delta} = - \frac{R'(t)}{R(t)}$$

- la conoscenza della curva a verso, nel tratto di normale funzionamento, ci dice che $S(t)$ è costante per cui possiamo risolvere l'equazione differenziale.

• Si ha

$$\lambda = -\frac{1}{R(t)} \frac{dR(t)}{dt}$$

$$\frac{dR(t)}{dt} + \lambda R(t) = 0 \quad \text{omogenea. Da cui}$$

$$R(t) = e^{-\lambda t} \quad \text{per } t \geq 0 \text{ e } 1 \text{ altrove}$$

dovendo essere $R(0) = 1$ per ogni motivo.

• immediatamente, in queste ipotesi, si ha

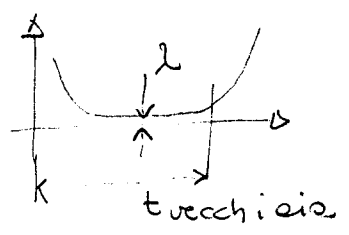
$$\left. \begin{aligned} Y_2(t) &= 1 - e^{-\lambda t} \\ y_2(t) &= \lambda e^{-\lambda t} \end{aligned} \right\} \text{ per } t \geq 0 \text{ e } 0 \text{ altrove}$$

• Interessante valutare l'aspettativa di vita o MTF

$$E\{x\} = \int_0^{\infty} x y_2(x) dx = \lambda \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx = \quad \text{per parti}$$
$$= \lambda \left\{ -\frac{x e^{-\lambda x}}{\lambda} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} dx \right\} = \frac{1}{\lambda}$$

• È importante ricordare sempre che questo risultato vale solo per il normale funzionamento, quando il tasso di questo è costante (cioè per $t < t_{vecchiaia}$) -

Può accadere che $MTF > t_{vecchiaia}$: significa solamente che ci sarà un bassissimo numero di questi accidentali prima del periodo di degenerazione finale



Osservazione: l'aspettativa di vita non mi dice che senz'altro il tale sistema vivrà MTF anni. Infatti

$$R\left(\frac{1}{\lambda}\right) = e^{-1} \quad 36.8\%$$

PS: quando si dice che l'uomo ha una aspettativa di vita di 76 anni, si fa riferimento a una $R(t)$ che **COMPRENDE** il fenomeno della vecchiaia (sarebbe $t_{vecchiaia}$)

• Valutazione dell' MTF di sistemi complessi, ottenuti combinando sottosistemi di cui si è nota l'affidabilità.

> Sistema SERIE: la rottura di un pezzo blocca tutto

$$P\{t > t_0\} = P\{t_1 > t_0 \text{ e } t_2 > t_0\} = R_1(t) \cdot R_2(t) \quad \text{se indipendenti}$$

Caso esponenziale

$$R(t) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$

$$MTF = \frac{1}{\frac{1}{MTF_1} + \frac{1}{MTF_2}} \quad (\text{formula del //})$$

> Sistema PARALLELO: un pezzo rotto può essere rimpiazzato da un altro che ne svolge la funzione

$$P\{t > t_0\} = 1 - P\{t_1 < t_0 \text{ e } t_2 < t_0\} = 1 - Y_1(t) Y_2(t) = R_1 + R_2 - R_1 R_2$$

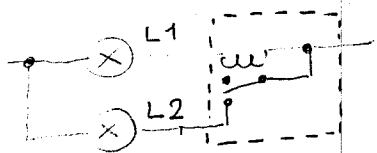
Caso esponenziale

$$R(t) = e^{-\lambda_1 t} + e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t}$$

$$MTF = MTF_1 + MTF_2 - \frac{1}{\frac{1}{MTF_1} + \frac{1}{MTF_2}}$$

è senz'altro maggiore di ciascuna delle due

Es:



se L1 brucia, L2 viene inserita dal relè (e la cui affidabilità si considera >>)

> Sistemi misti più complessi: le modalità di auto-riconfigurazione possono essere più complesse e non direttamente emulabili a serie e parallelo. Occorre ricostruire la statistica del tempo di vita globale

Componenti indipendenti				Esito
1	2	3	4	
OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	-	OK
OK	OK	-	OK	-

Gli eventi sono disgiunti e le relative probabilità note.

• Per i grossi sistemi disquisiti (non di supporto alla vita) si può costruire una teoria analoga che però tenga conto delle possibilità di riparazione.

Si ha così la variabile duale

τ_r : Tempo di riparazione (in cui il sistema resta guasto.)

$m_2(t)$: densità

$M_2(t)$: distribuzione (Manutenibilità)

> Lo studio delle statistiche di τ e τ_r permette di valutare la DISPONIBILITÀ di una grande apparecchiatura e impostarne efficaci strategie per la manutenzione.

• Progettazione per l'affidabilità. (anni)

Non è affatto banale progettare sistemi che siano affidabili - Soprattutto l'affidabilità non è quel cosa che si attacca dopo all'oggetto finito. Riguarda tutta la vita del sistema

> Progettazione

> Produzione (es: ISO 9000)

Qualità: controllo completo di tutto il processo produttivo
definizione delle procedure
considerazione del fattore umano
rilevamento costante dei parametri di qualità

• Torniamo alla progettazione.

Esistono diverse filosofie, non in alternativa, per affrontare questo tema.

> Migliorare la coesudabilità

È un passo ineludibile - Qualsiasi strategia per avere sistemi affidabili prevede una fase di DIAGNOSI. Si migliora la coesudabilità di un sistema per due vie

- Migliorare controllabilità e osservabilità dei singoli sottosistemi

- Partizionamento in sottosistemi fisicamente individuabili e accessibili
- ITAG e simili

- Aggiungere direttamente sul sistema ulteriore HW+SW con l'unico scopo di eseguire test di funzionamenti (built-in testing)

- Fase iniziale del boot di ogni calcolatore
- Verifica dei fine course e di ogni elemento dotato di feedback attuatore-sensore.

> Capacità di autodiagnosi (self-checking)

Il successivo passo prevede la capacità del sistema di autoverificare il corretto comportamento DURANTE il normale modo operativo.

Questa capacità si può ottenere

- Con un'abbondante "inverramento" del sistema con sensori che verifichino la congruenza dello stato del sistema con quanto impostato
- Con l'uso di codifiche per l'informazione nel sistema ridondanti e "preservate" delle operazioni eseguite dagli elaboratori previsti (CRC, parità) e dei checker.

> Possibilità di indirizzare il sistema questo verso un comportamento di "minimo danno" (fail-safe)

- Per esempio, un interruttore si può rompere in due modi: non fa più contatto ^① i contatti si incrociano e vanno in corto ^②
- L'ipotesi ① è considerata più "safe" della ② e orienta le tecniche costruttive di interruttori e relè.

> Realizzazione di sistemi tolleranti i guasti.

Tali sistemi riescono a compiere la loro missione anche in presenza di uno o più guasti. Perché ciò sia possibile il sistema deve

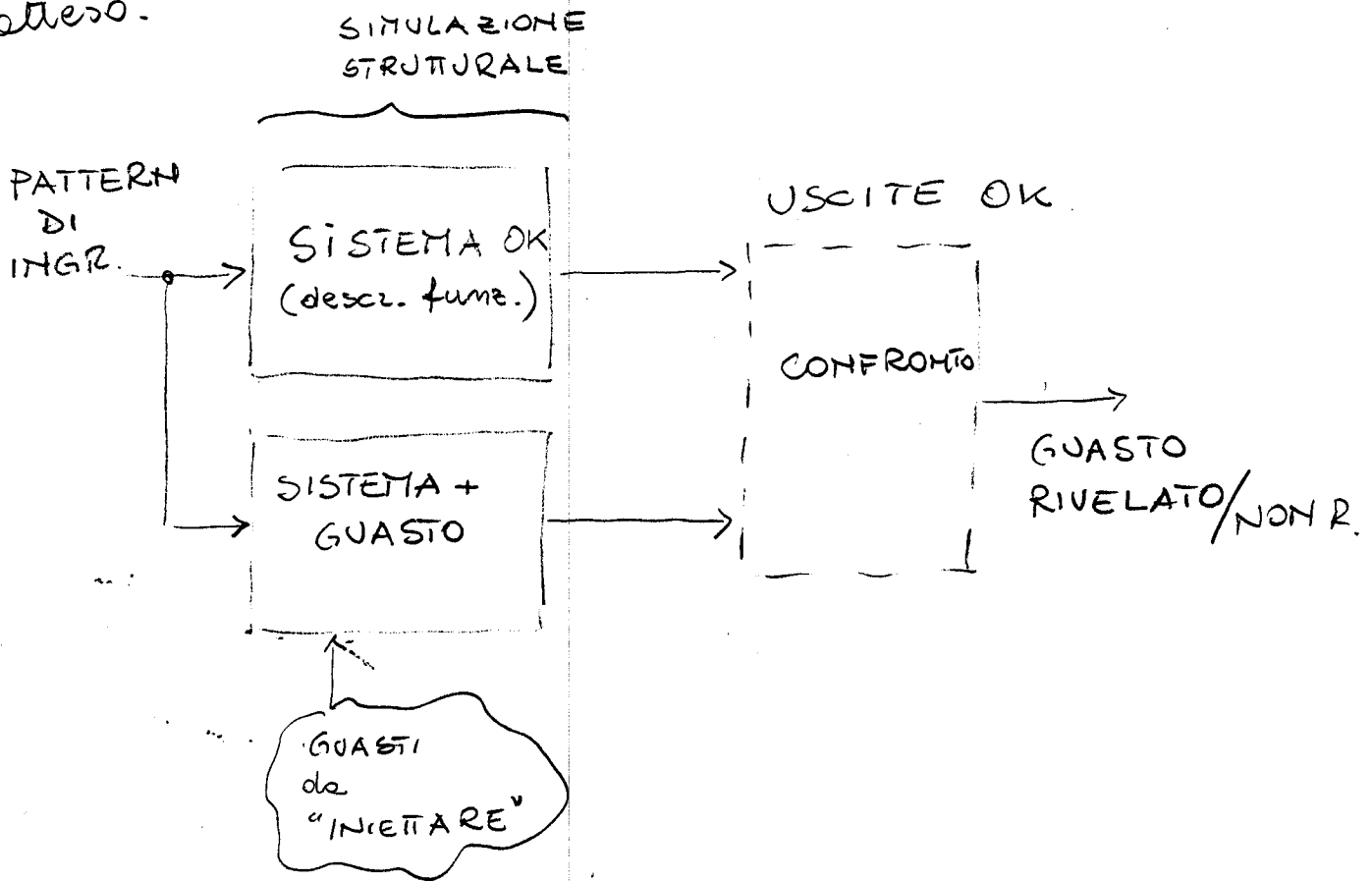
- Avere capacità di autodiagnosi
- Avere possibilità di autoconfigurarsi (ridondanza hardware)
- Avere possibilità di autocorreggersi (ridondanza nei codici e nel software)

Si può pensare anche a "graceful degradation..."

MIGLIORARE LA COLLAUDABILITÀ

2 1.5

- > Concetto di MODELLO di questo
- Per poter trattare il collaudo in modo rigoroso, occorre avere un modello preciso del questo che permetta di predirne gli effetti sul sistema.
- La presenza di un questo (di ogni questo potenziale) deve poter essere descritte in modo formale e date in pasto a un SIMULATORE.
- Rivelare un questo vuol dire dare una sequenza di ingressi (opportune) e osservare in uscita un comportamento diverso da quello atteso.



→ Esempio dei circuiti digitali: modello di questo logico "STUCK AT" (LINEA FISSA)

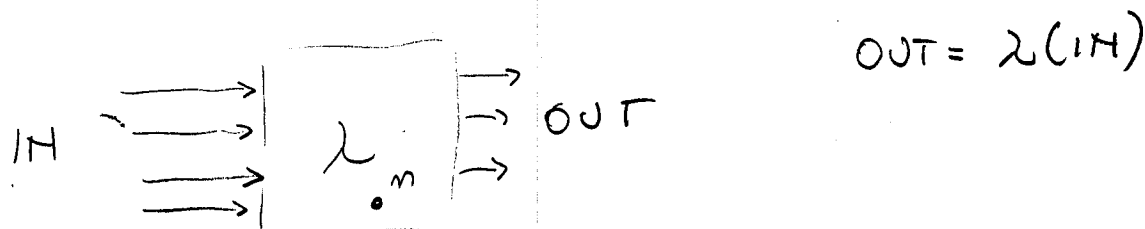
• Vantaggi -

- 1) Data la descrizione strutturale di un circuito, l'insieme dei guasti è ben definito e limitato
- 2) Uno stuck non può creare effetto memoria (cioè una rete COMBINATORIA non può diventare SEQUENZIALE)

• Svantaggi

Non è molto aderente alla realtà fisica degli odierni circuiti CMOS

> OSSERVABILITÀ e CONTROLLABILITÀ in reti combinate.



↑ SINGOLO GUASTO m stuck at \emptyset

* è controllabile se $\exists IN \Rightarrow (m=1)$ insieme $IN_{m=1}$

la controllabilità sarà $\frac{IN(m=1)}{IN \text{ totali}}$

* Se stacchiamo m da tutte le porte che esso pilota e forniamo questo valore dall'esterno abbiamo

$$OUT' = \lambda_m(IN, m)$$

sarà:

$$OUT = m \lambda_m(IN, 1) + \bar{m} \lambda_m(IN, 0)$$

È osservabile se $\exists IN \Rightarrow$

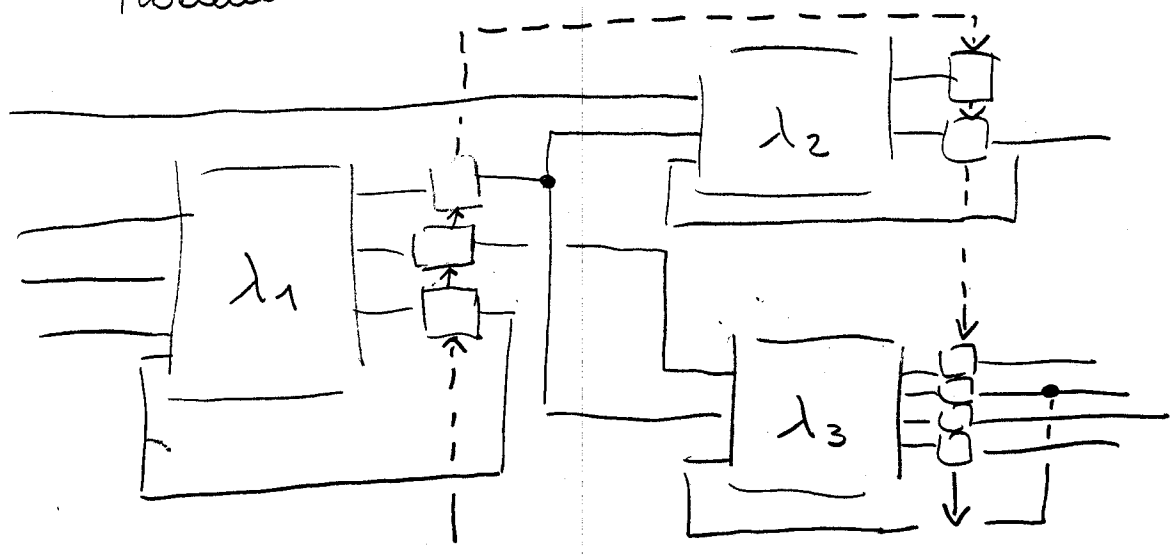
$$\lambda_m(IN, 1) \neq \lambda_m(IN, \emptyset)$$

→ Per RIVELARE occorrono entrambe le condizioni.

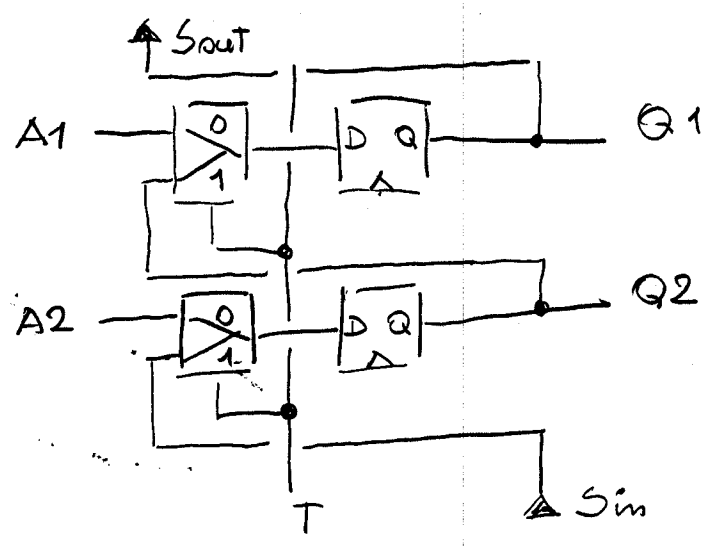
> Come collegare reti SEQUENZIALI

- Occorre avere accesso allo STATO della macchina
- Interrompere lunghi contatori
- Il concetto di scan-paths

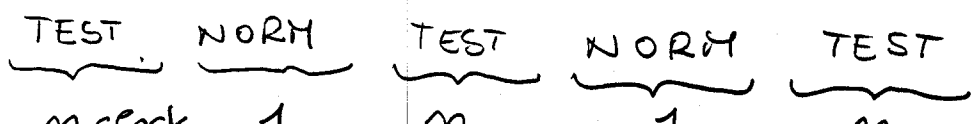
Modello di macchina sequenziale



TUTTI i registri che contengono lo stato interno hanno un collegamento ausiliare (pilotato da un ingresso indipendente T) che li fa diventare un UNICO SHIFT-REGISTER



Il collegando così può essere riportato a quello dello shift + 3 reti combinatorie



> Altri esempi di BUILT-IN testing

- Presenza di generatori di segnali di prova per la verifica di interi sistemi di misura
- Programmi diagnostici
- Coerenze tra più sistemi collegati alla stessa grandezza

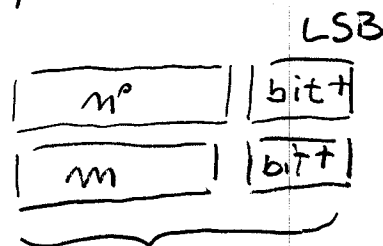
Es: sistemi sensore di posizione accurato (assl-) + rivelatori di \emptyset e fine corsa

- Sistemi in grado di eseguire DUMP in caso di eccezioni

Es: praticamente tutti i DSP delle ultime generazioni

- Uso di codifiche con ridondanza "chiuse" rispetto alle operazioni di interesse

Es: parità rispetto alle operazioni di max/min (bit aggiunti come LSB)



$n \leq m \rightarrow$ eseguite sul numero complessivo danno lo stesso risultato che se su n e m .

- prove del "move"



(in binario $2^n - 1$)^{*}

Somma	3847	4
Prodotto	1294	7 ↓
	+ 5141	②
	× 497,8018	① ↓

AUTODIAGNOSI

R 1.9

> Cosa ha oltre il built-in
ATTIVA durante il NORMALE Funzionamento
simile al nostro "Mi sento male"

> Esempio dei sistemi con "watchdog":
un sistema INDIPENDENTE osserva il
comportamento del sistema principale e
intreprnde eventuali azioni nel caso
rilevi comportamenti anomali.

WATCHDOG

> Il concetto di TIME-OUT per i processi che
dovrebbero (se tutto va bene) arrivare a
compimento in un tempo noto

FAIL SAFE esempi

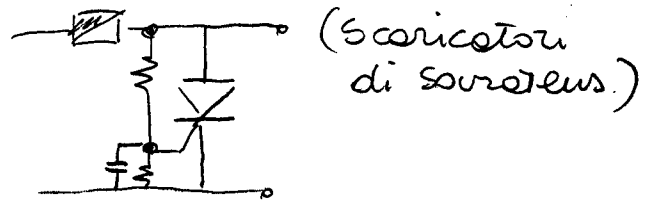
• Fusibile

• Circuiti di crowbar

• Valvole delle caffettiere
(fondano a 110°C)

• Semefori → giallo lampess.

• Scocchie e deformazione progressiva



(scaricatori
di sovratens.)

FAULT TOLERANT esempi

R 1.10

- Doppi circuiti frenanti (HW)
- Doppie luci di stop (HW)
- Codici a correzione d'errore (SW)
(dischi o nastri, canali disturbati)

Esempio di codice che rivela e corregge il singolo errore e rivela il doppio in $(m \times m)$ bit utili

$$\begin{array}{cccc|c} x & x & x & x & 0 \\ x & x & x & x & 0 \\ x & x & x & x & 0 \\ x & x & x & x & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} n \text{ righe} \\ +1 \text{ di parit\`a in verticale} \end{array}$$

m colonne

+1 di parit\`a in orizzontale

- Reni, polmoni
- Doppie lampade nel proiettore ...